



MERCREDI 7 JUIN

- 13h30 - 14h00 - Accueil
- 14h00 - 14h45 - Introduction et présentation des journées
Stéphane Clénet (Arts & Métiers)
Olivier Durteste (MECANOV)
Cyril Aujard (ZEISS)
- 14h45 - 15h15 - La métrologie du futur
Thierry Coorevits (Arts & Métiers)
- 15h15 - 15h45 - Pause
- 15h45 - 16h30 - L'inspection tomographique au cœur de l'atelier 4.0
Frank Thibault (ZEISS)
- 16h30 - 17h00 - Impact des nouvelles normes de spécifications géométriques des produits
Renald Vincent (CETIM)
- 16h30 - 17h00 - Démonstrations en laboratoire (5 ateliers - 20 min/atelier)
ZEISS, MAHR
- 19h30 - Dîner

JEUDI 8 JUIN

- 08h00 - 08h30 - Accueil
- 08h30 - 09h15 - Comment et pourquoi évaluer les incertitudes sur MMT (OVCM sous ZEISS Calypso) ?
François Hennebelle (Université de Bourgogne)
- 09h15 - 10h15 - Comment gérer le volume des données dans la métrologie du futur ?
Benjamin Bizon (ZEISS)
- 10h15 - 10h45 - Pause
- 10h45 - 11h30 - La très haute exactitude en métrologie 3D
Thierry Coorevits (Arts et Métiers)
- 11h30 - 12h15 - Témoignage industriel
Stefano Belotti (ZEISS)
Thomas Berthet (VECTEO)
- 12h15 - 12h30 - Conclusion
- 12h30 - 14h00 - Cocktail déjeunatoire